フォトニック結晶共振器とウィスパリングギャラリーモードの結合

遊部航希 (B4)

結合共振器を光情報処理に応用する場合,遅延時間と応答速度にはトレードオフの関係が存在する.異種の共振器による結合共振器は、各々の材料・製造プロセス・構造等が異なるため実現が 難しく、現在のところ報告されていない.しかし、異種共振器間の結合共振器は同種の共振器に よる結合共振器のトレードオフの関係を打ち破ることが期待される.本研究では、シリカトロイ ド共振器とフォトニック結晶共振器の結合手法・条件を検討した.

キーワード:フォトニック結晶、シリカトロイド共振器、結合共振器

1. 背景

微小光共振器は、光を微小領域に閉じ込めること によって光と物質の相互作用を増強する機能を持ち、 様々な光学現象が観測される.複数の微小光共振器 を連結した系は結合共振器と呼ばれ、共振モード間 の干渉効果による現象が観測でき、様々な応用可能 性が議論されている.結合共振器の応用例として動 的制御による光メモリ動作 [1] が挙げられ、シリカ トロイド共振器 [2] やフォトニック結晶共振器 [3] によって実証されている.シリカトロイド結合共振 器は高 Q 値のため 20 ns という長時間光バッファリ ングを実現しているが、スイッチ速度が 10 ns と遅 いという欠点がある.一方、フォトニック結晶結合 共振器による全光バッファは 4 ps という高速応答 を達成しているが、バッファ時間は 330 ps と短い.

本研究ではシリカトロイド共振器とフォトニック 結晶共振器による異種の共振器間の結合共振器を実 現することを目的とする.シリカトロイド共振器を ストレージ,フォトニック結晶共振器をゲートの共 振器に用いることで長時間かつ高速な光バッファリ ングが期待される.

2. 結合モード理論

本研究では、シリカトロイド共振器とフォトニック結晶共振器の結合系のモデル化に結合モード理論 (CMT: Coupled Mode Theory)を用いた.図1は、シリカトロイド共振器とフォトニック結晶共振器の結 合系の概略図である.この系のモデル式はCMTを用いると以下で与えられる.



図 1:シリカトロイド共振器とフォトニック結晶共振器の CMT モデルの概略図及びパラメータ.

$$\frac{da}{dt} = \left(j\omega_{\rm a} - \frac{\gamma_{\rm a} + \gamma_{\rm bus} + \gamma_{\rm drop}}{2}\right)a + j\frac{\kappa}{2}b + \sqrt{\gamma_{\rm bus}}e^{j\theta}s_{\rm in} \tag{1}$$

$$\frac{db}{dt} = \left(j\omega_{\rm b} - \frac{\gamma_{\rm b}}{2}\right)b + j\frac{\kappa}{2}a\tag{2}$$

$$s_{\rm out} = \sqrt{\gamma_{\rm drop}} e^{j\theta} a \tag{3}$$

ただし,a(b); フォトニック結晶(シリカトロイド) 共振器内のモード振幅. $\omega_a(\omega_b)$; 共振角周波数. $\gamma_a(\gamma_b)$; 固有損失. $s_{in}(s_{out})$; 入力(出力)導波路内のモード振 幅. $\gamma_{bus}(\gamma_{drop})$; フォトニック結晶と入力(出力)導波 路間の結合損失. κ ; フォトニック結晶共振器とシリ カトロイド共振器間の結合強度.

図 2 は、上式 (1)~(3) から求めた透過スペクトル $|s_{out}/s_{in}|^2$ である.図 2(a)は、 $\omega_a = \omega_b = 1550.0$ nm であり、図 2(b)は、 $\omega_a = 1550.0$ nm、 $\omega_b = 1550.1$ nm の場合である.



図 2: CMT モデルから計算した結合共振器系の透過スペクトル. (a); $\omega_a = \omega_b \sigma$ 場合. (b); $\omega_a \neq \omega_b \sigma$ 場合.

図 2(a) のように共振角周波数が一致している場合, 結合損失 $Q_{couple} = \omega/\kappa i Q_b = \omega/\gamma_b$ と同程度になる と、シリカトロイド共振器内に入力光が入り始める. $Q_{couple} i Q_a = \omega/\gamma_a$ と同程度の時、critical coupling と なり、共振角周波数では全ての入力光がシリカトロ イド共振器に閉じ込められる.図2(b)のように共振 角周波数が異なる場合、非対称なピークがシリカト ロイド共振器の共振角周波数付近に現れる.これを 利用してシリカトロイド共振器内に閉じ込められた 光を取り出すことが出来る.

3. エアブリッジ構造の作製

実験的にシリカトロイド共振器とフォトニック結 晶共振器の結合状態を実現するためには、フォトニ ック結晶をエアブリッジ構造にする必要がある. エ アブリッジ構造とは、フォトニック結晶のシリカク ラッドを剥がしてエアクラッドにした構造である. エアブリッジ構造にすることで、シリカトロイド共 振器を物理的にフォトニック結晶共振器に近づける ことが可能になる (κを大きくすることに対応する).



図3:エアブリッジ構造の作製プロセス.

図3はフォトニック結晶のエアブリッジ構造の作 製プロセスである.まず,フォトリソグラフィによ ってフォトニック結晶チップ上面の構造に合わせて フォトレジストを画定する.次に,チップの側面に フォトレジストを塗布することで,スポットサイズ 変換機構を保護する.この時,フォトレジストの粘 度が低いと表面張力により側面だけでなく上面にま で流れてしまいパターンが崩れてしまう.そのため, あらかじめフォトレジストを180~200℃で加熱し, フォトレジスト中の溶剤を蒸発させることで粘度を 増強させたものを用いた.最後に,27℃の恒温槽内 でバッファドフッ酸 (BHF)によるウェットエッチ ングを12分間行い,アセトン・エタノールによる超 音波洗浄を行い,エアブリッジ構造を作製した.作 製したエアブリッジ構造の顕微鏡写真を図4に示す.



図 4:シリカクラッド(上図)とエアクラッド(下図)の フォトニック結晶の顕微鏡画像.

4. 結合条件の検討

シリカトロイド共振器とフォトニック結晶共振器 の結合状態を実現するためには、物理的距離を近づ けるだけでは十分でなく、位相整合条件を満たす必 要がある.また、結合損失や、ライトコーン(光が チップ上下面に放射する領域)による損失が大きい と共振ピークが観測できない.図5はシリカクラッ ドとエアクラッドの幅変化型フォトニック結晶共振 器 [4] の透過スペクトルである.エアブリッジ構造 にするとライトライン(ライトコーンと非ライトコ ーンの境界)が短波長側にシフトするため共振ピー クがライトコーンによる損失を受けなくなる. 伝搬 モード自体も短波長側に 60 nm 程度シフトするも ののライトラインのシフト量の方が大きいため、共 振ピークはライトコーンの領域外にあることが期待 される.図5の黒線(シリカクラッド)では伝搬モ ードがライトコーンによる損失を受けているが、赤 線(エアクラッド)では伝搬モードはライトコーン による損失を受けていないことが確認できる.

しかし,エアブリッジ構造のフォトニック結晶共振器ではフォトニックバンドギャップ内に共振ピークを観測することが出来なかった.このことから十分に損失を抑制することができていないことが原因として考えられる.損失の原因として,側面に塗布した高粘度のフォトレジストの残滓による散乱損失の増加やエアクラッドとシリカクラッドの境界面での反射による損失の増加などが考えられる.前者に関しては十分な超音波洗浄を行うことで改善できるが、エアブリッジ構造はシリコン層が220 nm と薄く、超音波洗浄によって壊れてしまうことが少なくない.そのため、溶剤を蒸発させる量を調節して、短時間の超音波洗浄で十分に洗浄できるような粘度のフォトレジストを用いることが求められる.



図 5:シリカクラッド(黒)とエアクラッド(赤)の場合の幅変化型フォトニック結晶共振器の透過スペクトル. 5. 今後の展望

フォトニック結晶のエアブリッジ構造を作製することが可能になったが、共振ピークを観測するためには作製プロセスの最適化が必要である.また、結合 共振器の形成のためには高*Q*値のエッジシリカトロ イド共振器を作製する必要があり、現段階では10⁶ オーダー程度の共振器しか作製できていないため、 こちらも作製プロセスの最適化が必要である.

参考文献

- Q. Xu, P. Dong and M. Lipson, Nature Physics 3 406-410 (2007)
- [2] W. Yoshiki, Y. Honda, T. Tetsumoto, K. Furusawa, N. Sekine, and T. Tanabe, Sci Rep 7 10688 (2017).
- [3] J. Upham, Y. Fujita, Y. Kawamoto, Y. Tanaka, B. S. Song, T. Asano, and S. Noda, Opt. Express 21 3809-3817 (2013)
- [4] E. Kuramochi, M. Notomi, S. Mitsugi, A. Shinya, and T. Tanabe, Phys. Lett. 88 041112 (2006)